PROJET FINAL
Norme internationale

ISO/FDIS 16206

Analyse quantitative de la phase de quartz résiduel dans les briques de silice — Méthode par diffraction des rayons X

Phase quantitative analysis of residual quartz in silica bricks — X-ray diffraction method

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)
Document Preview

ISO/FDIS 16206
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f0568579-b78f-4d7e-a81b-de489077394a/iso-fdis-16206

ISO/TC **33**

Secrétariat: **BSI**

Début de vote:
2025-04-08

Vote clos le:
2025-06-03

LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS, NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COM-MERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION NATIONALE.

Numéro de référence
ISO/FDIS 16206:2025(fr)

© ISO 2025

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)
Document Preview

ISO/FDIS 16206
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f0568579-b78f-4d7e-a81b-de489077394a/iso-fdis-16206

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2025

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos ..... **iv**
1 Domaine d'application **1**
2 Références normatives **1**
3 Termes et définitions **1**
4 Principe **2**
5 Appareillage **2**
6 Matériaux de référence à teneur en quartz alpha **2**
7 Échantillonnage **2**
8 Mode opératoire **3**
8.1 Nombre d'éprouvettes 3
8.2 Établissement d'une courbe d'étalonnage 3
8.2.1 Préparation des matériaux de référence 3
8.2.2 Préparation des éprouvettes 3
8.2.3 Paramètres de mesure 3
8.2.4 Mesure 4
8.2.5 Courbe d'étalonnage 4
8.3 Analyse de l'échantillon 4
8.3.1 Préparation des éprouvettes 4
8.3.2 Mesure 4
9 Résultats d'essai **4**
10 Rapport d'essai **4**
Annexe A (informative) **Résultats de l'essai interlaboratoires et statistiques de fidélité** **6**
Annexe B (informative) **Calcul de la limite de détection et de la limite de quantification** **8**
Bibliographie **9**

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)
Document Preview
ISO/FDIS 16206
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f0568579-b78f-4d7e-a81b-de489077394a/iso-fdis-16206

© ISO 2025 – Tous droits réservés